АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины
«Системы качества»

Направление подготовки 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Профиль «Метрология наноструктур и нанотехнологий»

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2017

Цель изучения дисциплины:

Обеспечение теоретических знаний и формирование практических навыков по принципам построения, разработке, внедрению, обеспечению функционирования и постоянного совершенствования систем менеджмента качества, оценке их результативности и степени подготовленности к сертификации.

Задачи изучения дисциплины:

Изучение накопленного отечественного и зарубежного опыта разработки и организации внедрения систем менеджмента качества в организациях различных сфер деятельности и форм собственности; изучение требований нормативной документации (международных, национальных стандартов, руководящих указаний на системы менеджмента), являющейся основой построения систем менеджмента качества; изучение возможных направлений совершенствования систем качества и получение навыков и умений в применении современных методов для их реализации; изучение требований, методов организации и проведения внутренних и сертификационных аудитов систем качества.

Перечень формируемых компетенций:

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПВК-7 - поддерживать единое информационное пространство планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла изделий

ПВК-8 - владение проблемно-ориентированного метода анализа, синтеза и оптимизации процессов системы менеджмента качества

ПК-29 - готовностью участвовать в научной и педагогической деятельности в области метрологии, технического регулирования и управления качеством

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет